



HY11P42
Datasheet
8-Bit RISC-like Mixed Signal Microcontroller
Embedded 18-Bit $\Sigma\Delta$ ADC

目錄

1. 特點	5
2. 引腳定義	6
2.1 SSOP28 引腳圖	6
2.2 TSSOP28 引腳圖	6
2.3 QFN24 引腳圖	7
2.4 I/O引腳定義(SSOP28)	8
2.5 I/O引腳定義(TSSOP28)	10
2.6 I/O引腳定義(QFN24)	12
3. 應用電路	14
3.1 橋式感測器 I	14
3.2 橋式感測器 II	15
3.3 4-20mA兩線式電流表頭	16
4. 功能概述	17
4.1 內部方塊圖	17
4.2 相關說明與支援文件	17
4.3 SD18 Network	18
5. 暫存器列表	19
6. 電氣特性	20
6.1 Recommended operating conditions	20
6.2 Internal RC Oscillator	21

6.3	Supply current into VDD excluding peripherals current.....	22
6.4	Port1~5	24
6.5	Reset(Brownout, External RST pin, Low Voltage Detect)	25
6.6	Power System.....	27
6.7	SD18,Power Supply and recommended operating conditions	29
6.7.1	PGA,Power Supply and recommended operating conditions	29
6.7.2	SD18,performance II (fSD18=250KHz).....	29
6.7.3	SD18,Temperature sensor.....	32
6.7.4	SD18 Noise Performance	33
6.8	Build-In EPROM(BIE)	35
7.	訂貨資訊.....	36
8.	封裝型式資訊.....	37
8.1	SSOP28(E028)	37
8.2	QFN24(N024).....	39
8.3	TSSOP28(T028)	40
9.	修訂記錄.....	42

注意：

- 1、本說明書中的內容，隨著產品的改進，有可能不經過預告而更改。請客戶及時到本公司網站下載更新 <http://www.hycontek.com>
- 2、本規格書中的圖形、應用電路等，因第三方工業所有權引發的問題，本公司不承擔其責任。
- 3、本產品在單獨應用的情況下，本公司保證它的性能、典型應用和功能符合說明書中的條件。當使用在客戶的產品或設備中，以上條件我們不作保證，建議客戶做充分的評估和測試。
- 4、請注意輸入電壓、輸出電壓、負載電流的使用條件，使 IC 內的功耗不超過封裝的容許功耗。對於客戶在超出說明書中規定額定值使用產品，即使是瞬間的使用，由此所造成的損失，本公司不承擔任何責任。
- 5、本產品雖內置防靜電保護電路，但請不要施加超過保護電路性能的過大靜電。
- 6、本規格書中的產品，未經書面許可，不可使用在要求高可靠性的電路中。例如健康醫療器械、防災器械、車輛器械、車載器械及航空器械等對人體產生影響的器械或裝置，不得作為其部件使用。
- 7、本公司一直致力於提高產品的品質和可靠度，但所有的半導體產品都有一定的失效概率，這些失效概率可能會導致一些人身事故、火災事故等。當設計產品時，請充分留意冗餘設計，採用安全指標，這樣可以避免事故的發生。
- 8、本規格書中內容，未經本公司許可，嚴禁用於其他目的之轉載或複製。

1. 特點

- 8 位元加強型精簡指令集，共有 66 個指令
包含硬體乘法指令及查表指令
- 2.2V to 3.6V 工作電壓範圍，-40°C~85°C 工作溫度範圍。
- 外部石英震盪器及內部高精度 RC 震盪器，
6 種 CPU 工作時脈切換選擇，可讓使用者
達到最佳省電規劃
 - 運行模式 300uA@2MHz
 - 待機模式 3uA@28KHz
 - 休眠模式 1uA
- 2KWord OTP (One Time Programmable)
Type 程式記憶體，128Byte 資料記憶體
- Brownout and Watch dog Timer，可防止
CPU 進入死機模式
- 18bit 全差動輸入 $\Sigma\Delta$ ADC 類比數位轉換器
 - 內置(Programmable Gain Amplifier)
及可有 1/4、1/2、1、.....128 倍 10 種
輸入信號放大倍率選擇
 - 內置輸入零點調整，可針對不同應用
增加其量測範圍
 - 內置高阻抗輸入緩衝器(4 以上輸入倍
率不適用)
 - 內置絕對溫度感測器
- 1.0V, 1.2V 的內部類比電路共地電壓源，具
有 Push-Pull 驅動能力，可提供傳感器驅動
電壓
- LVD 低電壓檢測功能具 14 段檢測電壓設置
與外部輸入電壓檢測功能
- 類比電壓源 VDDA 可選擇 4 種不同輸出電
壓，具 10mA 穩壓電壓源輸出能力
- 8-bit Timer A
- 8-bit Timer C 模組具 PWM/PFD 波形產生
功能
- EUART 模組
- Build-In EPROM (BIE)
- Support 6 stack level

2. 引腳定義

2.1 SSOP28 引腳圖

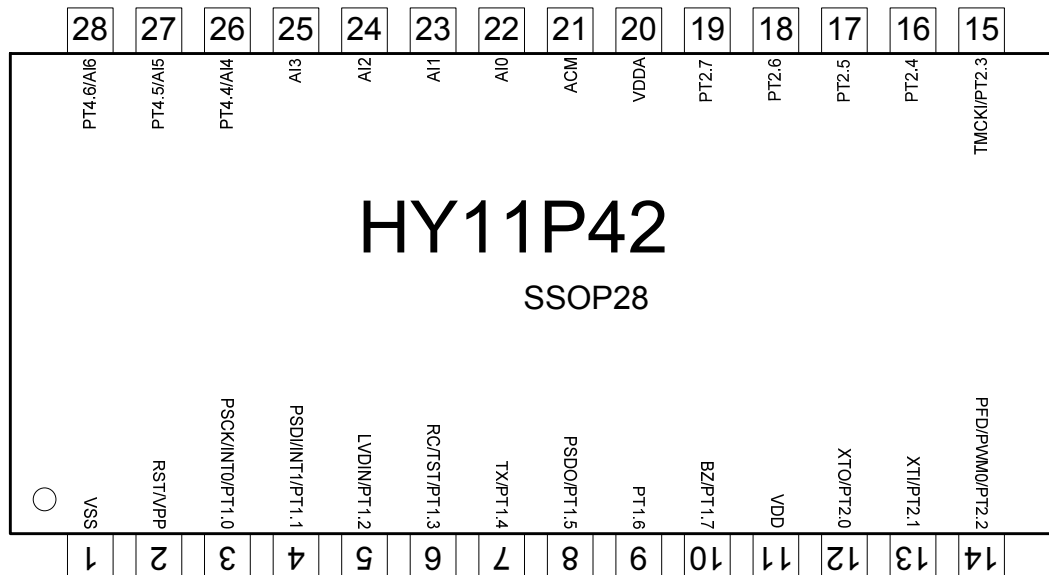


圖 2-1 HY11P42 SSOP28 引腳圖

2.2 TSSOP28 引腳圖

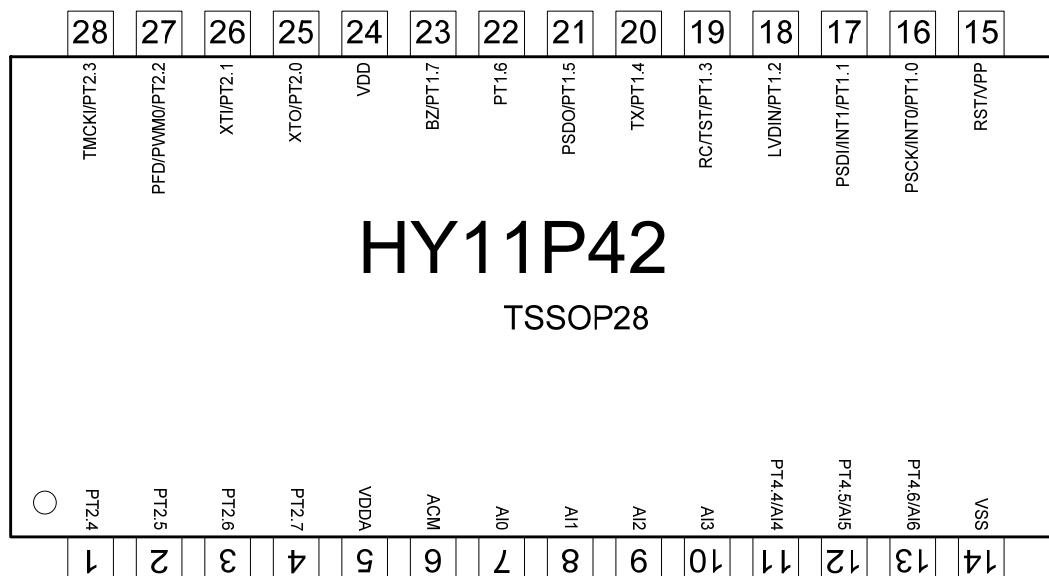


圖 2-1 HY11P42 TSSOP28 引腳圖

註 1：VPP 與 RST 復用同一接口，非燒錄 EPROM 時禁止輸入電壓超過 5.8V

註 2：TST 與 PT1.3 復用同一接口，操作時禁止輸入電壓超過 VDD+0.3V

註 3：若不將 PT1.3 設定成外部引腳按鍵，可以提升抗干擾能力

HY11P42

Embedded 18-Bit $\Sigma\Delta$ ADC

8-Bit RISC-like Mixed Signal Microcontroller

2.3 QFN24 引腳圖

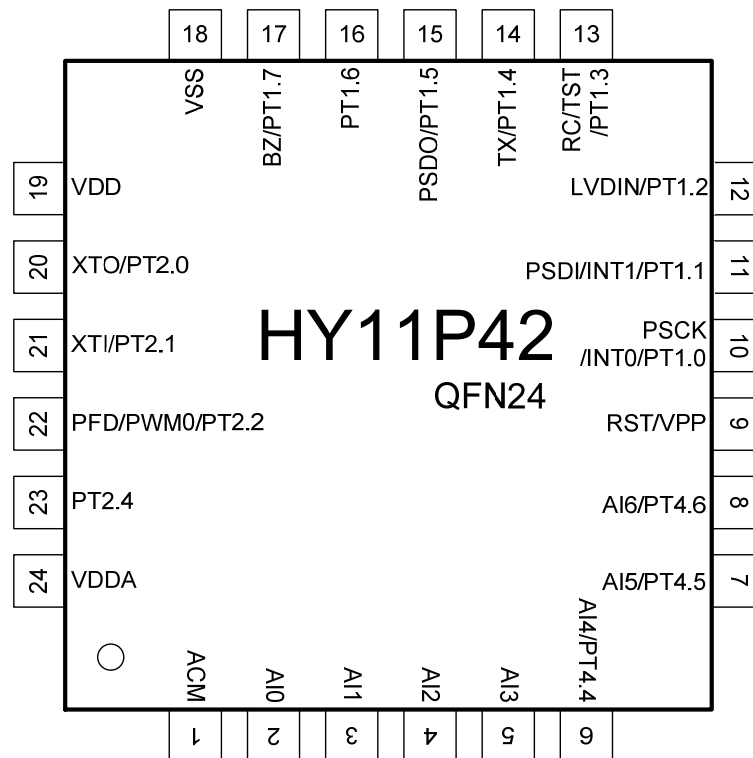


圖 2-3 HY11P42 QFN24 引腳圖

註 1：VPP 與 RST 復用同一接口，非燒錄 EPROM 時禁止輸入電壓超過 5.8V

註 2：TST 與 PT1.3 復用同一接口，操作時禁止輸入電壓超過 VDD+0.3V

註 3：若不將 PT1.3 設定成外部引腳按鍵，可以提升抗干擾能力

2.4 I/O 引腳定義(SSOP28)

“I/O”輸入/輸出, “I”輸入, “O”輸出, “S”史密特觸發, “C”CMOS 特性兼容輸出與輸入, “P”電壓源, “A”類比通道

編號	引腳名稱	引腳特性		功能說明
		格式	緩衝	
1	VSS	P	P	晶片工作電壓源接地端
2	RST/VPP RST VPP	I P	S P	復位晶片 EPROM 讀/寫時的電壓源
3	PT1.0/INT0/PSCK PT1.0 INT0 PSCK	I I I	S S S	數位輸入 中斷源 INT0 OTP 讀/寫介面 SCK 接口
4	PT1.1/INT1/PSDI PT1.1 INT1 PSDI	I I I	S S S	數位輸入 中斷源 INT1 OTP 讀/寫介面 SDI 接口
5	PT1.2/LVDIN PT1.2 LVDIN	I A	S A	數位輸入 LVD 外部信號輸入接口
6	PT1.3/TST/RC PT1.3 RC TST	I I/O I	S S S	數位輸入 EUART 通訊介面 RC 接口 測試模式致能輸入 (未開放)
7	PT1.4/TX PT1.4 TX	I/O I/O	S S	數位輸入/輸出 EUART 通訊介面 TX 接口
8	PT1.5/PSDO PT1.5 PSDO	I/O I/O	S C	數位輸入/輸出 OTP 讀/寫介面 SDO 接口
9	PT1.6 PT1.6	I/O	S	數位輸入/輸出
10	PT1.7/BZ PT1.7 BZ	I/O O	S C	數位輸入/輸出 蜂鳴器輸出端
11	VDD	P	P	晶片工作電壓源
12	PT2.0/XTO PT2.0 XTO	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸出端

13	PT2.1/XTI	PT2.1 XTI	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸入端
14	PT2.2/PWM0/PFD	PT2.2 PWM0 PFD	I/O O O	C C C	數位輸入/輸出 PWM 輸出接口 PFD 輸出接口
15	PT2.3/TMCKI	PT2.3 TMCKI	I/O I	S S	數位輸入/輸出 TIMERC 時脈源輸入接口
16	PT2.4		I/O	S	數位輸入/輸出
17	PT2.5		I/O	S	數位輸入/輸出
18	PT2.6		I/O	C	數位輸入/輸出
19	PT2.7		I/O	C	數位輸入/輸出
20	VDDA		P	P	穩壓器輸出，類比電路電壓源
21	ACM		P	P	內部類比電路共地引腳
22	AI0		A	A	類比輸入通道
23	AI1		A	A	類比輸入通道
24	AI2		A	A	類比輸入通道
25	AI3		A	A	類比輸入通道
26	PT4.4/AI4	PT4.4 AI4	I A	C A	數位輸入 類比輸入通道
27	PT4.5/AI5	PT4.5 AI5	I A	C A	數位輸入 類比輸入通道
28	PT4.6/AI6	PT4.6 AI6	I A	C A	數位輸入 類比輸入通道

表 2-1 引腳定義與功能說明

2.5 I/O 引腳定義(TSSOP28)

“I/O”輸入/輸出, “I”輸入, “O”輸出, “S”史密特觸發, “C”CMOS 特性兼容輸出與輸入, “P”電壓源, “A”類比通道

編號	引腳名稱	引腳特性		功能說明
		格式	緩衝	
1	PT2.4	I/O	S	數位輸入/輸出
2	PT2.5	I/O	S	數位輸入/輸出
3	PT2.6	I/O	C	數位輸入/輸出
4	PT2.7	I/O	C	數位輸入/輸出
5	VDDA	P	P	穩壓器輸出, 類比電路電壓源
6	ACM	P	P	內部類比電路共地引腳
7	AI0	A	A	類比輸入通道
8	AI1	A	A	類比輸入通道
9	AI2	A	A	類比輸入通道
10	AI3	A	A	類比輸入通道
11	PT4.4/AI4	I	C	數位輸入
		A	A	類比輸入通道
12	PT4.5/AI5	I	C	數位輸入
		A	A	類比輸入通道
13	PT4.6/AI6	I	C	數位輸入
		A	A	類比輸入通道
14	VSS	P	P	晶片工作電壓源接地端
15	RST/VPP	I	S	復位晶片
		P	P	EPROM 讀/寫時的電壓源
16	PT1.0/INT0/PSCK	I	S	數位輸入
		I	S	中斷源 INT0
		I	S	OTP 讀/寫介面 SCK 接口
17	PT1.1/INT1/PSDI	I	S	數位輸入
		I	S	中斷源 INT1
		I	S	OTP 讀/寫介面 SDI 接口
18	PT1.2/LVDIN	I	S	數位輸入

	LVDIN	A	A	LVD 外部信號輸入接口
19	PT1.3/TST/RC PT1.3 RC TST	I I/O I	S S S	數位輸入 EUART 通訊介面 RC 接口 測試模式致能輸入（未開放）
20	PT1.4/TX PT1.4 TX	I/O I/O	S S	數位輸入/輸出 EUART 通訊介面 TX 接口
21	PT1.5/PSDO PT1.5 PSDO	I/O I/O	S C	數位輸入/輸出 OTP 讀/寫介面 SDO 接口
22	PT1.6 PT1.6	I/O	S	數位輸入/輸出
23	PT1.7/BZ PT1.7 BZ	I/O O	S C	數位輸入/輸出 蜂鳴器輸出端
24	VDD	P	P	晶片工作電壓源
25	PT2.0/XTO PT2.0 XTO	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸出端
26	PT2.1/XTI PT2.1 XTI	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸入端
27	PT2.2/PWM0/PFD PT2.2 PWM0 PFD	I/O O O	C C C	數位輸入/輸出 PWM 輸出接口 PFD 輸出接口
28	PT2.3/TMCKI PT2.3 TMCKI	I/O I	S S	數位輸入/輸出 TIMERC 時脈源輸入接口

表 2-2 引腳定義與功能說明

2.6 I/O 引腳定義(QFN24)

“I/O”輸入/輸出, “I”輸入, “O”輸出, “S”史密斯觸發, “C”CMOS 特性兼容輸出與輸入, “P”電壓源, “A”類比通道

編號	引腳名稱	引腳特性		功能說明
		格式	緩衝	
1	ACM	P	P	內部類比電路共地引腳
2	AI0	A	A	類比輸入通道
3	AI1	A	A	類比輸入通道
4	AI2	A	A	類比輸入通道
5	AI3	A	A	類比輸入通道
6	PT4.4/AI4	PT4.4	I	數位輸入
		AI4	A	類比輸入通道
7	PT4.5/AI5	PT4.5	I	數位輸入
		AI5	A	類比輸入通道
8	PT4.6/AI6	PT4.6	I	數位輸入
		AI6	A	類比輸入通道
9	RST/VPP	RST	I	復位晶片
		VPP	P	EPROM 讀/寫時的電壓源
10	PT1.0/INT0/PSCK	PT1.0	I	數位輸入
		INT0	I	中斷源 INT0
		PSCK	I	OTP 讀/寫介面 SCK 接口
11	PT1.1/INT1/PSDI	PT1.1	I	數位輸入
		INT1	I	中斷源 INT1
		PSDI	I	OTP 讀/寫介面 SDI 接口
12	PT1.2/LVDIN	PT1.2	I	數位輸入
		LVDIN	A	LVDIN 外部信號輸入接口
13	PT1.3/TST/RC	PT1.3	I	數位輸入
		RC	I/O	EUART 通訊介面 RC 接口
		TST	I	測試模式致能輸入（未開放）
14	PT1.4/TX	PT1.4	I/O	數位輸入/輸出

	TX	I/O	S	EUART 通訊介面 TX 接口
15	PT1.5/PSDO PT1.5 PSDO	I/O I/O	S C	數位輸入/輸出 OTP 讀/寫介面 SDO 接口
16	PT1.6 PT1.6	I/O	S	數位輸入/輸出
17	PT1.7/BZ PT1.7 BZ	I/O O	S C	數位輸入/輸出 蜂鳴器輸出端
18	VSS	P	P	晶片工作電壓源接地端
19	VDD	P	P	晶片工作電壓源
20	PT2.0/XTO PT2.0 XTO	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸出端
21	PT2.1/XTI PT2.1 XTI	I/O A	S A	數位輸入/輸出 外接振盪器輸入端
22	PT2.2/PWM0/PFD PT2.2 PWM0 PFD	I/O O O	C C C	數位輸入/輸出 PWM 輸出接口 PFD 輸出接口
23	PT2.4	I/O	S	數位輸入/輸出
24	VDDA	P	P	穩壓器輸出，類比電路電壓源

表 2-3 引腳定義與功能說明

3. 應用電路

3.1 橋式感測器 I

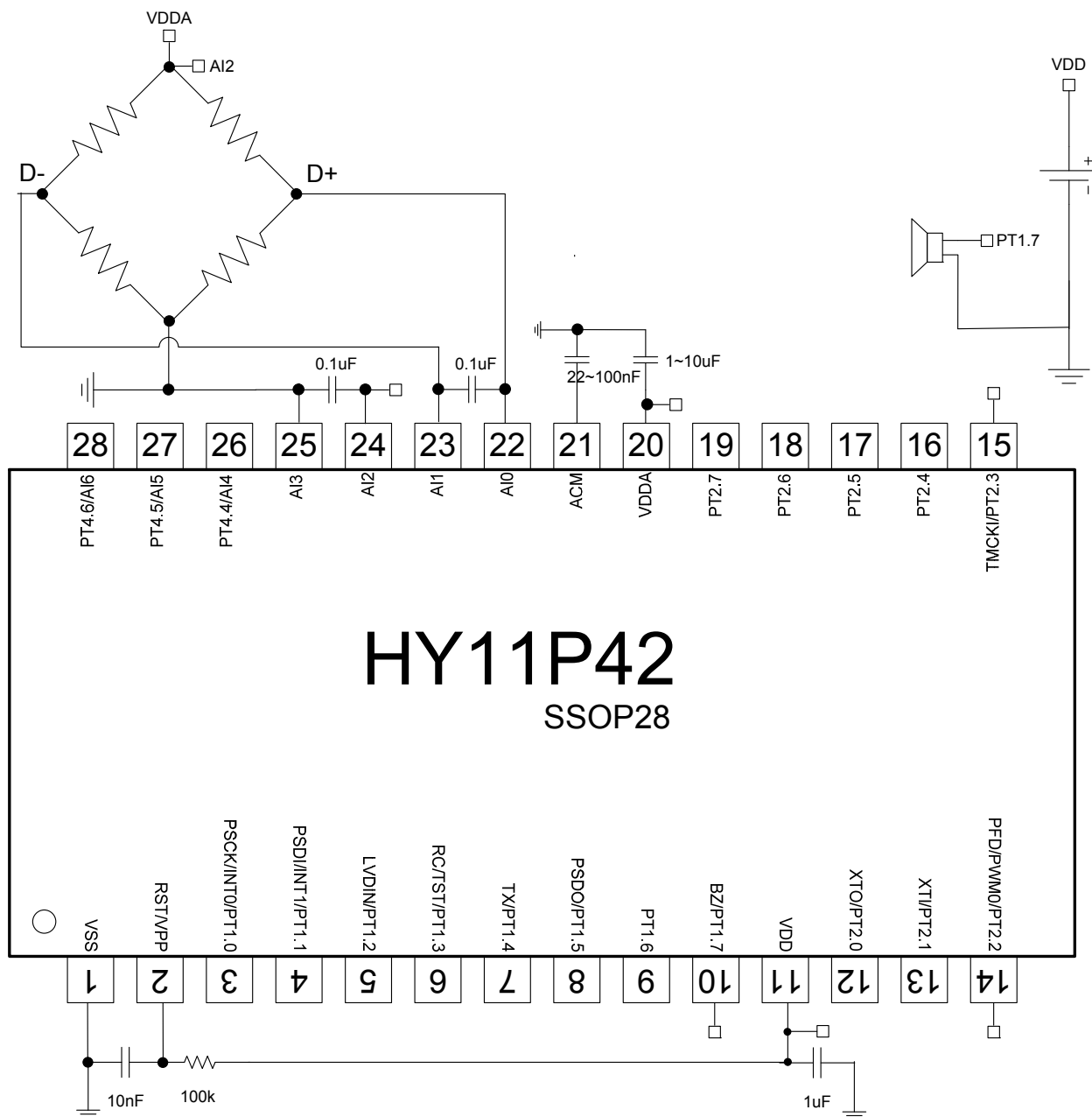


圖 3-1 橋式感測器應用電路

註：零點電壓位置可透過 DCSET[2:0]進行偏壓調整

註：校正參數儲存可使用 BIE 功能取代之

3.2 橋式感測器 II

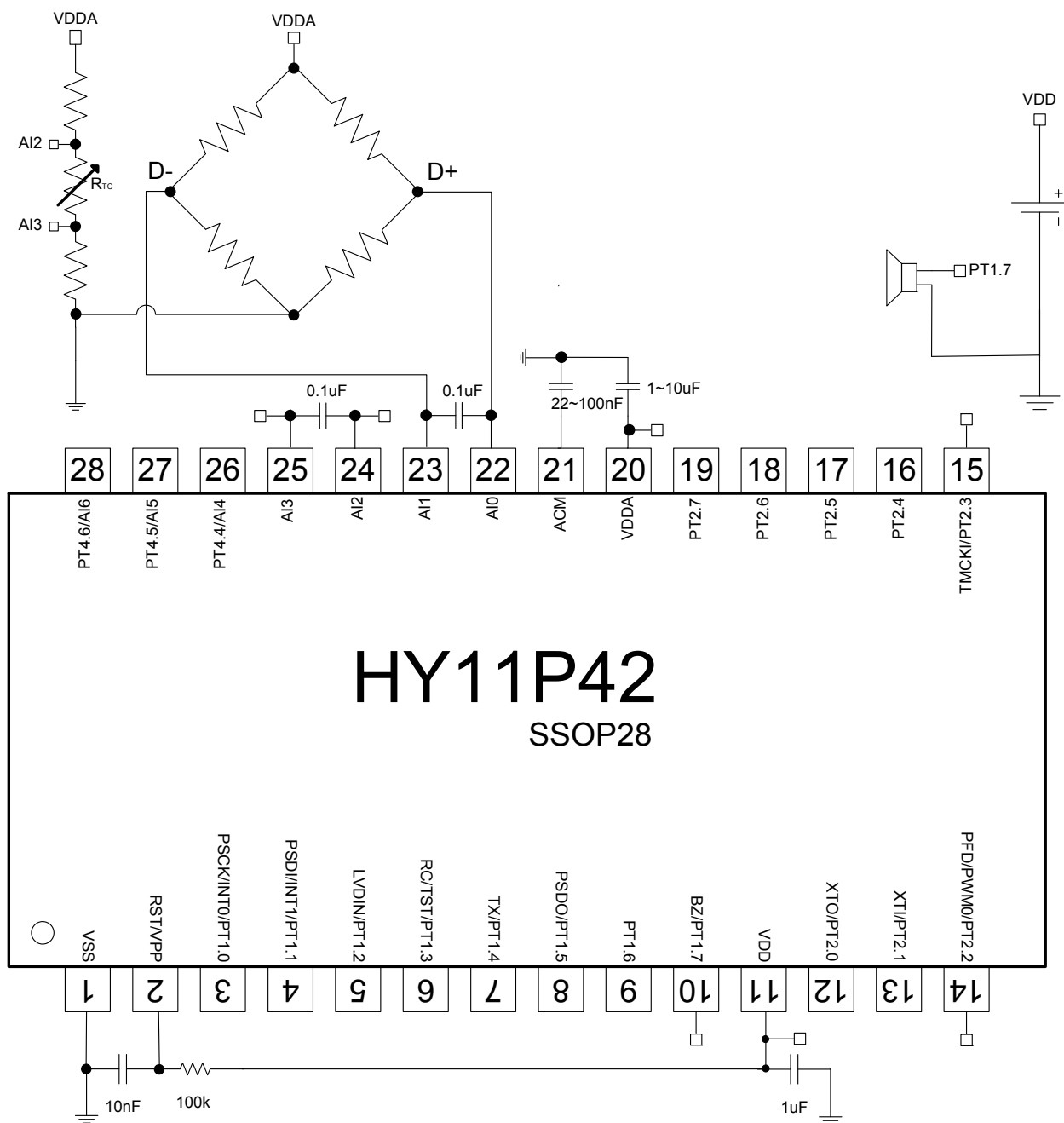


圖 3-2 具溫度補償的橋式感測器應用電路

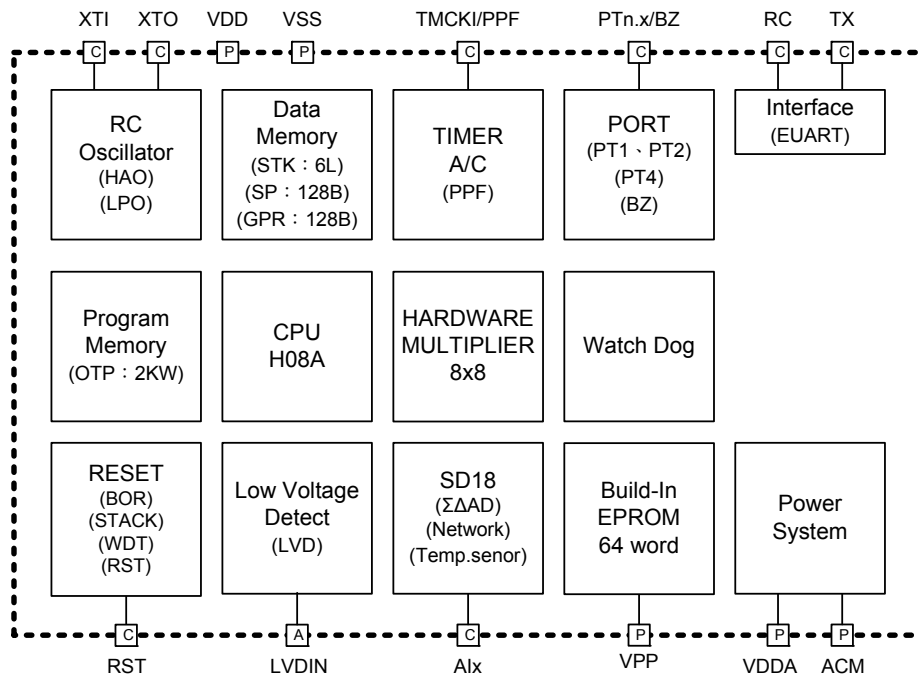
註：使用溫度補償電阻 NTC 基本線路

註：關於零點電壓位置可透過 DCSET[2:0]進行偏壓調整

註：校正參數儲存可使用 BIE 功能取代之

4. 功能概述

4.1 内部方块圖



[P] Power Pad [D] Digital Pad [A] Analog Pad [C] Common I/O Pad

圖 4-1 HY11P42 内部方块圖

4.2 相關說明與支援文件

晶片功能相關使用說明書

DS-HY11P42

HY11P42 說明書

UG-HY11S14

HY11Pxx 系列使用說明書

APD-CORE002-Vxx

H08A 指令說明書

開發工具相關使用說明書

APD-HYIDE006-Vxx

HY11xxx 系列開發工具軟體使用說明書

APD-HYIDE005-Vxx

HY11xxx 系列開發工具硬體使用說明書

APD-OTP001-Vxx

OTP 產品燒錄引腳說明書

產品生產相關使用說明書

APD-HYIDE004-Vxx

HY1xxxx 系列生產線專用燒錄器說明書

BDI-HY11P42-Vxx

HY11P42 個別產品的裸片打線資訊

4.3 SD18 Network

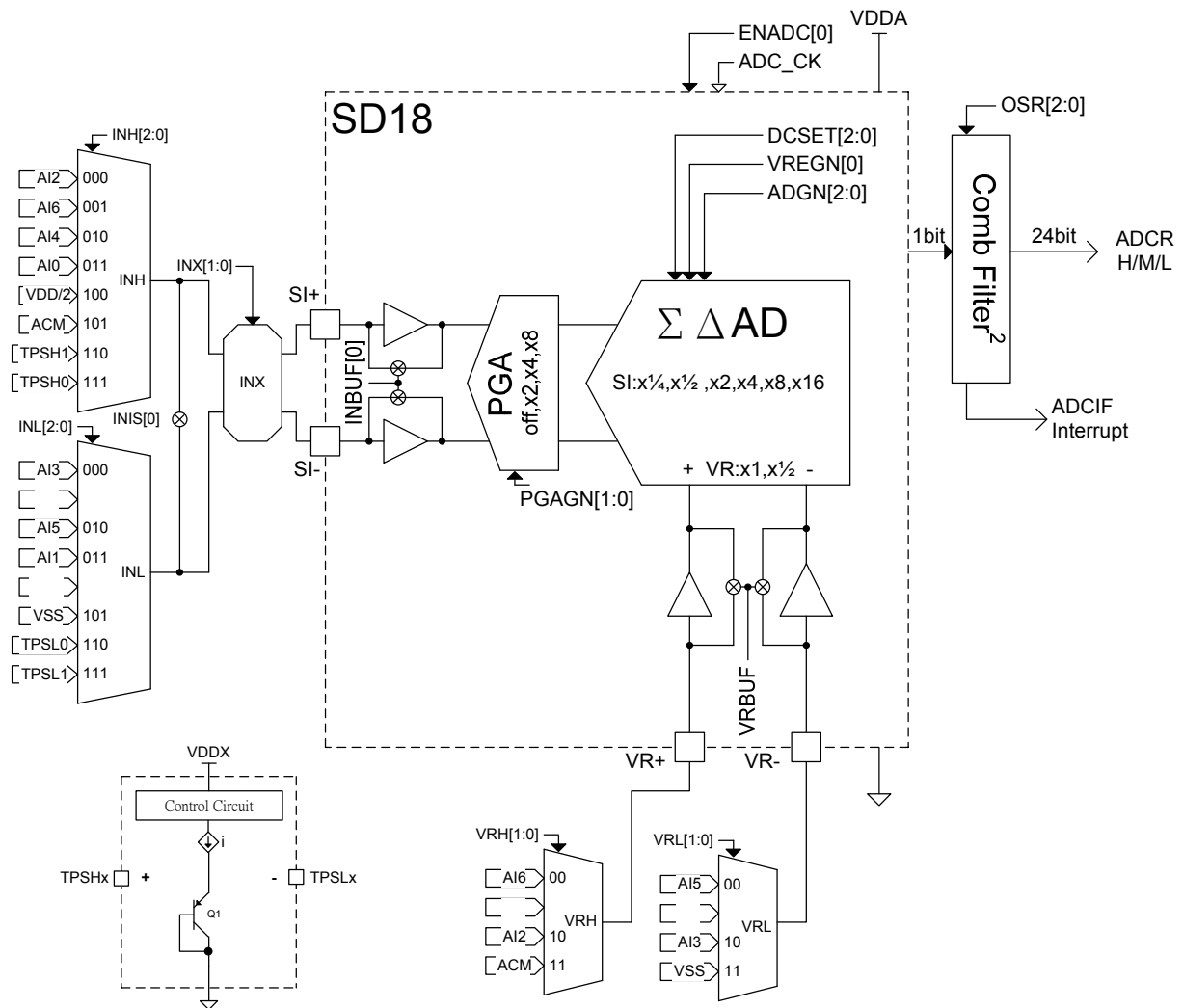


圖 4-2 SD18 Network

5. 暫存器列表

"0"no use, "1"read/write, "w"write, "r"read, "r0"only read 0, "r1"only read 1, "w0"only write 0, "w1"only write 1 "x"unimplemented bit, "x"unknown, "u"unchanged, "d"depends on condition													
Address	File Name	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	A-RESET	I-RESET	R/W	
00H	INDF0	Contents of FSR0 to address data memory -value of FSR0 not changed								N/A	N/A	*****	
01H	POINC0	Contents of FSR0 to address data memory -value of FSR0 post-incremented								N/A	N/A	*****	
02H	PODEC0	Contents of FSR0 to address data memory -value of FSR0 post-decremented								N/A	N/A	*****	
03H	PRINC0	Contents of FSR0 to address data memory -value of FSR0 pre-incremented								N/A	N/A	*****	
04H	PLUSW0	Contents of FSR0 to address data memory -value of FSR0 offset by W								N/A	N/A	*****	
05H	INDF1	Contents of FSR1 to address data memory -value of FSR0 not changed								N/A	N/A	*****	
06H	POINC1	Contents of FSR1 to address data memory -value of FSR0 post-incremented								N/A	N/A	*****	
07H	PODEC1	Contents of FSR1 to address data memory -value of FSR0 post-decremented								N/A	N/A	*****	
08H	PRINC1	Contents of FSR1 to address data memory -value of FSR0 pre-incremented								N/A	N/A	*****	
09H	PLUSW1	Contents of FSR1 to address data memory -value of FSR0 offset by W								N/A	N/A	*****	
0FH	FSR0H								FSR0[8]	X	U	*****	
10H	FSR0L	Indirect Data Memory Address Pointer 0 Low Byte,FSR0[7:0]								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
11H	FSR1H								FSR1[8]	X	U	*****	
12H	FSR1L	Indirect Data Memory Address Pointer 1 Low Byte,FSR1[7:0]								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
16H	TOSH						TOS[10]	TOS[9]	TOS[8]	000	000	*****	
17H	TOSL	Top-of-Stack Low Byte (TOS<7:0>)								0000 0000	0000 0000	*****	
18H	STKPTR	STKFL	STKUN	STKOV			STKPR[2:0]			000 .000	000 .000	r,rw0,rw0,-,r,r,f	
1AH	PCLATH						PC[10]	PC[9]	PC[8]	000	000	*****	
1BH	PCLATL	PC Low Byte for PC<7:0>								0000 0000	0000 0000	*****	
1DH	TBLPTRH						TBLPTR[10]	TBLPTR[9]	TBLPTR[8]	000	000	*****	
1EH	TBLPTRL	Program Memory Table Pointer Low Byte (TBLPTR<7:0>)								0000 0000	0000 0000	*****	
1FH	TBLDH	Program Memory Table Latch High Byte								0000 0000	0000 0000	*****	
20H	TBLDL	Program Memory Table Latch Low Byte								0000 0000	0000 0000	*****	
21H	PRODH	Product Register of Multiply High Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
22H	PRODL	Product Register of Multiply Low Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
23H	INTE1	GIE	ADCFIE	TMCIE		TMAIE	WDTIE	E1IE	E0IE	000 .0000	000 .0000	*****	
24H	INTE2	TXIE	RCIE				SSPIE			00 .00	00 .00	*****	
26H	INTF1		ADCFIF	TMCIF		TMAIF	WDTIF	E1IF	E0IF	.00 .0000	.00 .0000	*****	
27H	INTF2	TXIF	RCIF				SSPIF			00 .00	00 .00	*****	
29H	WREG	Working Register								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
2AH	BSRCN								BSR[0]	0	0	*****	
2BH	STATUS				C	DC	N	OV	Z	...X xxxx	...U uuuu	*****	
2CH	PSTATUS	PD	TO	IDLEB	BOR		SKERR			000d .00	u0uu .d0	rw0,rw0,rw0,rw0,-rw0,-r	
2DH	LVDON		LVDIFG	LVD	LVDON	VLDX[3:0]				.000 0000	.000 0000	*****	
30H	PWRCON	ENVDDA	VDDAX[1:0]		ENACM					0000	0000	*****	
31H	MCKCN1	ADCS[2:0]			ADCK	XTHSP	XTSP	ENXT	ENHAO	0000 0001	0000 0001	*****	
32H	MCKCN2			LSC	HSC	HSS[1:0]		CPUCK[1:0]		.00 0000	.00 0000	*****	
33H	MCKCN3					PERCK	BZS[2:0]			0000	0000	*****	
39H	ADCRH	ADC conversion memory HighByte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
3AH	ADCRM	ADC conversion memory Middle Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
3BH	ADCRL	ADC conversion memory Low Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
3CH	ADCCN1	ENADC	ENHIGN	ENCHP	PGAGN[1:0]			ADGN[2:0]		0000 0000	0000 0000	*****	
3DH	ADCCN2			INBUF	VRBUF	VREGN	DCSET[2:0]			.00 0000	.00 0000	*****	
3EH	ADCCN3	OSR[2:0]								000 .000	000 .000	*****	
3FH	AINET1	INH[2:0]			INL[2:0]			INIS		0000 000	0000 000	*****	
40H	AINET2	VRH[1:0]			INX[1:0]			VRL[1:0]		000 000	000 000	*****	
41H	TMACN	ENTMA	TMACK	TMAS[1:0]			ENWDT	WDTS[2:0]			0000 0000	0000 0000	***** w1,r,w1
42H	TMAR	TimerA data register								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
46H	TMCCN	ENTMC	TMCC[1:0]			TMCS1[2:0]		TMCS0[1:0]		0000 0000	0000 0000	*****	
47H	PRC	TimerC programmable register								1111 1111	1111 1111	*****	
48H	TMCR	TimerC register								0000 0000	0000 0000	r,r,f,f,r,f,f	
4EH	PASC	PASF	PASC[1:0]							0.00	0.00	*****	
4FH	PWMCN	ENPWM	ENPFD	PWMRL[1:0]						0000	0000	*****	
51H	PWMR	PWM MSB Byte register								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
63H	URCON	ENSP	ENTX	TX9	TX9D	PARITY			WUE	0000 0.0	0000 0.0	*****	
64H	URSTA		RC9D	PERR	FERR	OERR	RCIDL	TRMT	ABDOVF	.000 0110	.000 0110	r,r,f,f,r,f,rw0	
65H	BAUDCON					ENCR	RC9	ENADD	ENABD	0000	0000	*****	
66H	BRGRH	Baud Rate Generator Register High Byte								...X xxxx	...U uuuu	*****	
67H	BRGRL	Baud Rate Generator Register Low Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
68H	TXREG	UART Transmit Register								xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
69H	RCREG	UART Receive Register								xxxx xxxx	uuuu uuuu	r,r,f,f,r,f,f	
6AH	PT4		PT4.6	PT4.5	PT4.4					...x ...	...u ...	r,r,f,f,r,f,f	
6BH	PT4DA		DA4.6	DA4.5	DA4.4					.111	.111	*****	
6CH	PT4PU		PU4.6	PU4.5	PU4.4					.000	.000	*****	
6DH	PT1	PT1.7	PT1.6	PT1.5	PT1.4	PT1.3	PT1.2	PT1.1	PT1.0	xxxx xxxx	uuuu uuuu	***** r,r,f,f	
6EH	TRISC1	TC1.7	TC1.6	TC1.5	TC1.4					0000	0000	*****	
6FH	PT1DA						DA1.2			0...	0...	*****	
70H	PT1PU	PU1.7	PU1.6	PU1.5	PU1.4	PU1.3	PU1.2	PU1.1	PU1.0	0000 0000	0000 0000	*****	
71H	PT1M1					INTEG1[1:0]		INTEG0[1:0]		0000	0000	*****	
72H	PT1M2		PM1.7[0]		PM1.6[0]		PM1.5[0]		PM1.4[0]	.0.0.0.0	.0.0.0.0	*****	
74H	PT2	PT2.7	PT2.6	PT2.5	PT2.4	PT2.3	PT2.2	PT2.1	PT2.0	xxxx xxxx	uuuu uuuu	*****	
75H	TRISC2	TC2.7	TC2.6	TC2.5	TC2.4	TC2.3	TC2.2	TC2.1	TC2.0	0000 0000	0000 0000	*****	

表 5-1 HY11P42 暫存器列表

6. 電氣特性

Absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)

Voltage applied at V_{DD} to V_{SS}	-0.2 V to 4.0 V
Voltage applied to any pin	-0.2 V to $V_{DD} + 0.3$ V
Voltage applied to RST/VPP pin	-0.2 V to 6.9 V
Voltage applied to TST/PT1.3 pin	-0.2 V to $V_{DD} + 1$ V
Diode current at any device terminal	± 2 mA
Storage temperature, Tstg: (unprogrammed device)	-55°C to 150°C
(programmed device)	-40°C to 85°C
Total power dissipation.	0.5w
Maximum output current sink by any PORT1 to PORT3 I/O pin.	25mA

6.1 Recommended operating conditions

$T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter		Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	unit
V _{DD}	Supply Voltage		All digital peripherals and CPU		2.2		3.6	V
			Analog peripherals		2.4		3.6	
V _{SS}	Supply Voltage				0		0	
XT	External	Watch crystal	V _{DD} = 2.2V, ENXT[0]=1	XTSP[0]=0, XTHSP[0]=0	32.768K		Hz	
	Oscillator	Ceramic resonator		XTSP[0]=1, XTHSP[0]=0	450K	8M		
	Frequency	Crystal		XTSP[0]=1, XTHSP[0]=0	1M	8M		

6.2 Internal RC Oscillator

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit
HAO	High Speed Oscillator frequency	ENHAO[0]=1	1.7	2.0	2.3	MHz
LPO	Low Power Oscillator frequency	V_{DD} supply voltage be enable LPO	22	28	35	KHz

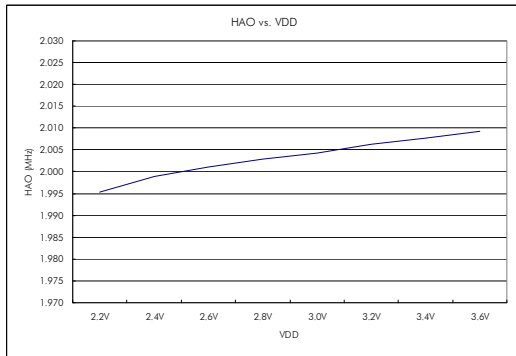


Figure 6.2-1 HAO vs. VDD

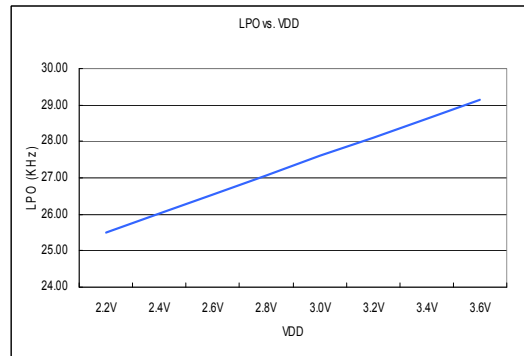


Figure 6.2-2 LPO vs. VDD

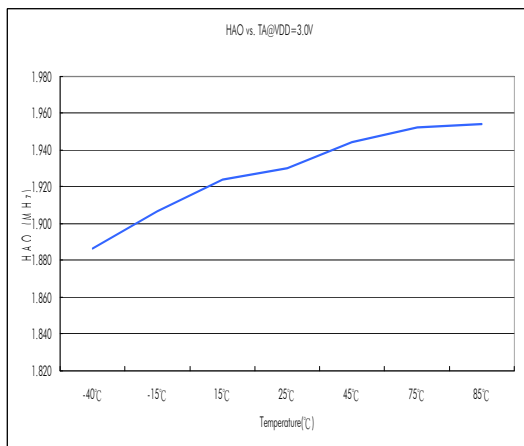


Figure 6.2-3 HAO vs. Temperature

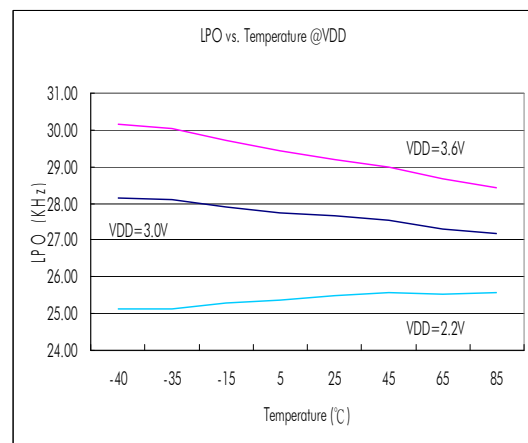


Figure 6.2-4 LPO vs. Temperature

6.3 Supply current into VDD excluding peripherals current

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $\text{OSC_LPO} = 28\text{KHz}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit
I_{AM1}	Active mode 1	OSC_CY = 8MHz, OSC_HAO = off, CPU_CK = 8MHz		1.2	2	mA
I_{AM2}	Active mode 2	OSC_CY = off, OSC_HAO = 2MHz, CPU_CK = 2MHz		0.32	0.55	mA
I_{AM3}	Active mode 3	OSC_CY = off, OSC_HAO = 2MHz, CPU_CK = 1MHz		0.18	0.3	mA
I_{LP1}	Low Power 1	OSC_CY = 32768Hz, OSC_HAO = off, CPU_CK = 16384Hz		7	12	μA
I_{LP2}	Low Power 2	OSC_CY = off, OSC_HAO = off, CPU_CK = LPO, Idle state		1.65	3	μA
I_{LP3}	Low Power 3	OSC_CY = off, OSC_HAO = off, CPU_CK = off, Sleep state		0.65	1.2	μA

OSC_CY : External Oscillator frequency.

OSC_HAO : Internal High Accuracy Oscillator frequency.

CPU_CK : CPU core work frequency.

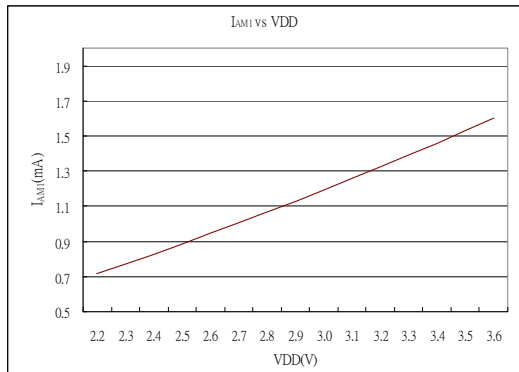


Figure 6.3-1 I_{AM1} vs. VDD

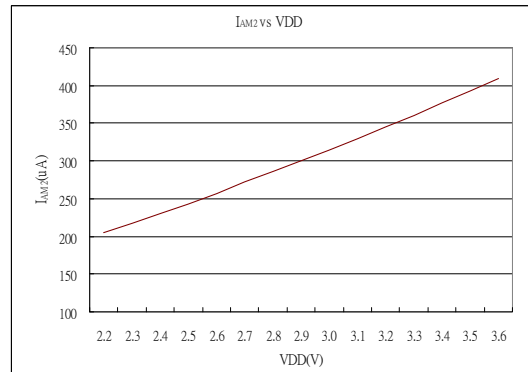


Figure 6.3-2 I_{AM2} vs. VDD

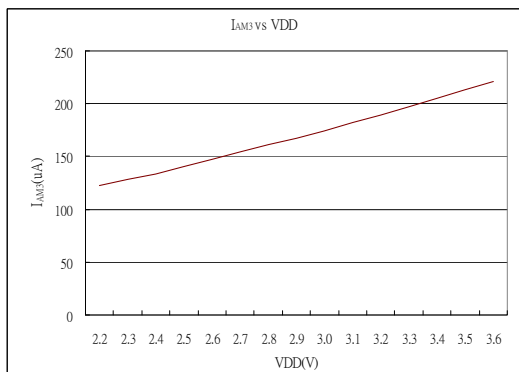


Figure 6.3-3 I_{AM3} vs. VDD

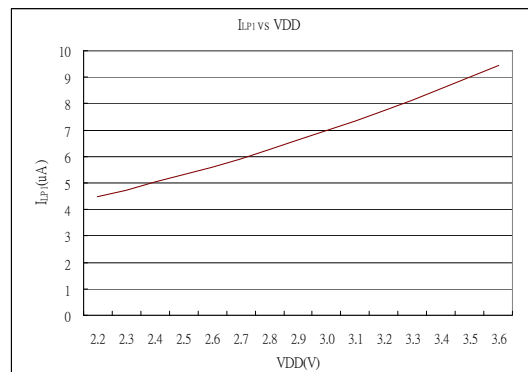


Figure 6.3-4 I_{LP1} vs. VDD

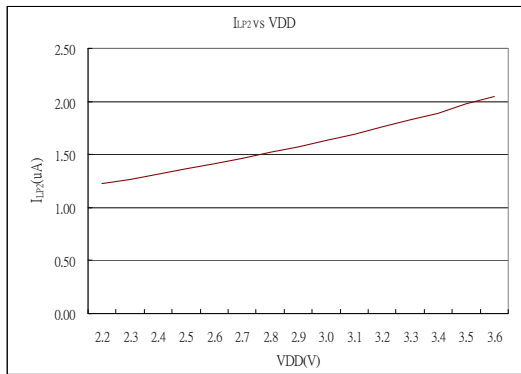


Figure 6.3-5 I_{LP2} vs. VDD

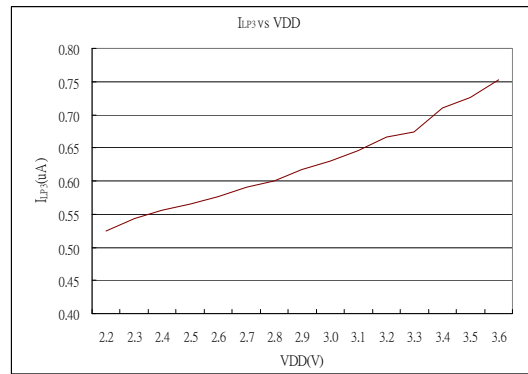


Figure 6.3-6 I_{LP3} vs. VDD

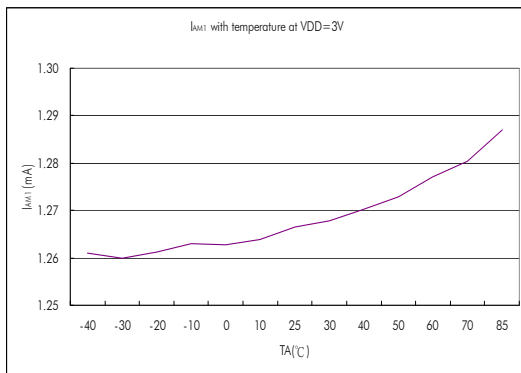


Figure 6.3-7 I_{AM1} vs. Temperature

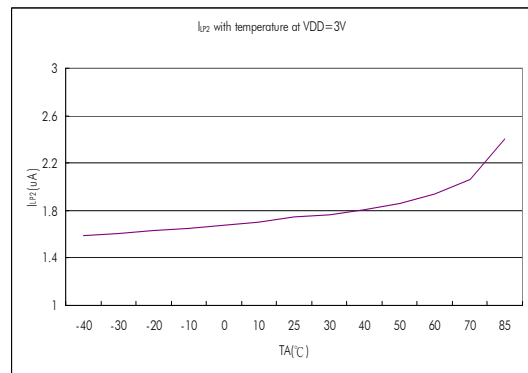


Figure 6.3-8 I_{LP2} vs. Temperature

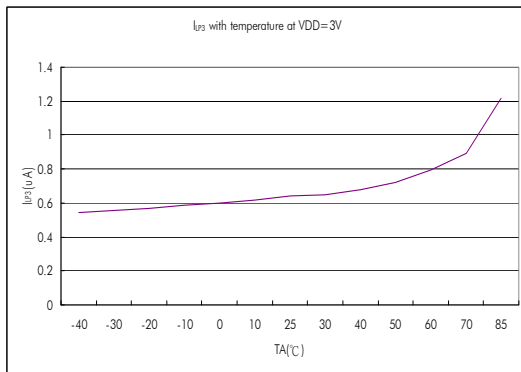


Figure 6.3-9 I_{LP3} vs. Temperature

6.4 Port1~5

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit
Input voltage and Schmitt trigger and leakage current and timing						
V_{IH}	High-Level input voltage				2.1	V
V_{IL}	Low-Level input voltage		0.9			
V_{hys}	Input Voltage hysteresis($V_{IH} - V_{IL}$)			0.8		V
I_{LKG}	Leakage Current				0.1	μA
R_{PU}	Port pull high resistance			180		$\text{k}\Omega$
Output voltage and current and frequency						
V_{OH}	High-level output voltage	$I_{OH}=10\text{mA}$	$V_{DD} - 0.3$			V
V_{OL}	Low-level output voltage	$I_{OL}=-10\text{mA}$			$V_{SS} + 0.3$	

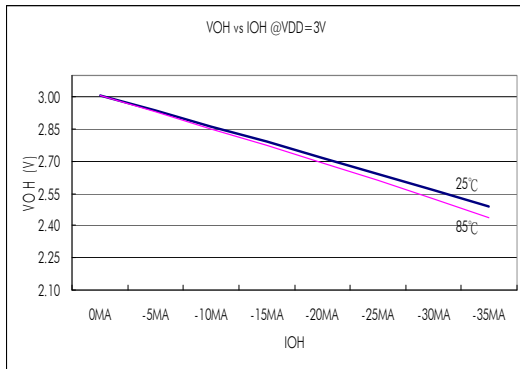


Figure 6.4-1 V_{OH} vs. I_{OH} @ $V_{DD}=3.0\text{V}$

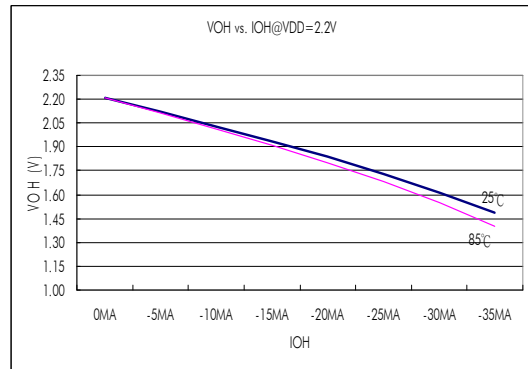


Figure 6.4-2 V_{OH} vs. I_{OH} @ $V_{DD}=2.2\text{V}$

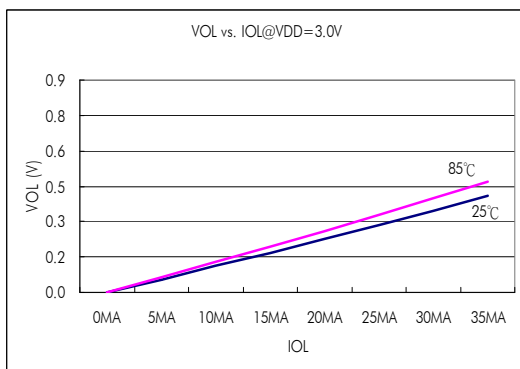


Figure 6.4-3 V_{OL} vs. I_{OL} @ $V_{DD}=3.0\text{V}$

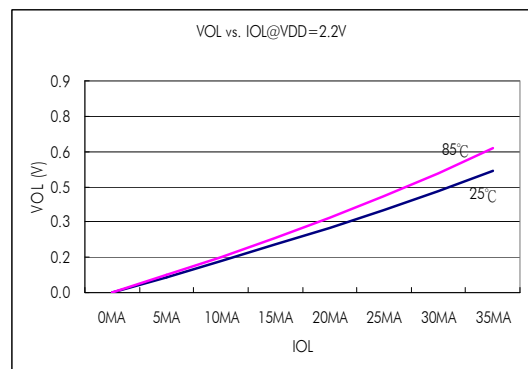


Figure 6.4-4 V_{OL} vs. I_{OL} @ $V_{DD}=2.2\text{V}$

6.5 Reset(Brownout, External RST pin, Low Voltage Detect)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit	
BOR	Pulse length needed to accepted reset internally, t _{d-LVR}		2			us	
	V _{DD} Start Voltage to accepted reset internally (L→H), V _{LVR}		1.6	1.85	2.1	V	
	Hysteresis, V _{HYS-LVR}		70			mV	
RST	Pulse length needed as RST/VPP pin to accepted reset internally, t _{d-RST}		2			us	
	Input Voltage to accepted reset internally		0.9			V	
	Hysteresis, V _{HYS-RST}		0.8			V	
LVD	Operation current, I _{LVD}		10			15	uA
	External input voltage to compare reference voltage		1.2			V	
	Compare reference voltage temperature drift	T _A = -40℃ ~ 85 ℃	100			ppm/℃	
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1110b		3.3			V	
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1101b		3.2				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1100b		3.1				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1011b		3.0				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1010b		2.9				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1001b		2.8				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=1000b		2.7				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0111b		2.6				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0110b		2.5				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0101b		2.4				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0100b		2.3				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0011b		2.2				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0010b		2.1				
	Detect V _{DD} voltage rang by user option, V _{SVS} VLDx[3:0]=0001b		2.0				
BOR : Brownout Reset							
LVR : Low Voltage Reset of BOR							
LVD : Low Voltage Detect							
RST : External Reset pin							

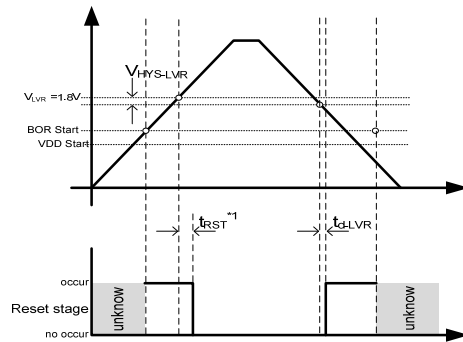


Figure 6.5-1 BOR reset diagram

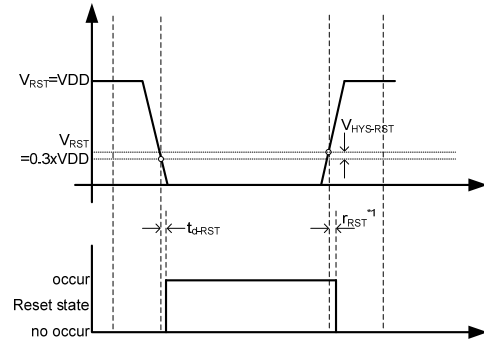


Figure 6.5-2 RST reset diagram

*1 t_{RST} : Please see BOR Introduce of HY11Pxx series User's Guide (UG-HY11S14-Vxx).

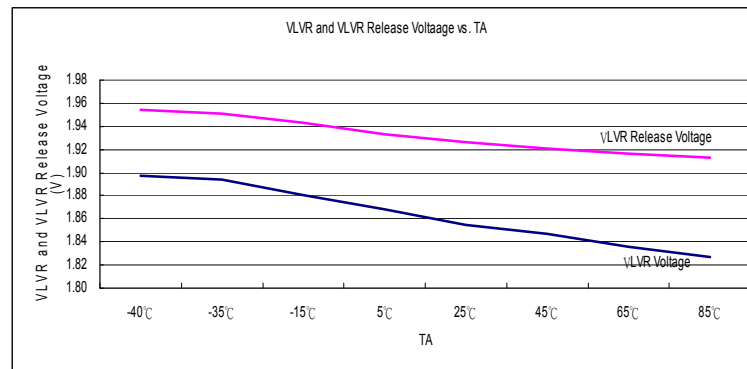


Figure 6.5-3 LVR vs. Temperature

6.6 Power System

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	unit
VDDA	VDDA operation current, I_{VDDA}	$I_L = 0\text{mA}$	VDDAX[1:0]=00b		22		μA
	Select VDDA output voltage	$I_L = 0.1\text{mA}$, $V_{DD} \geq V_{DDA} + 0.2\text{V}$	VDDAX[1:0]=00b		3.3		V
			VDDAX[1:0]=01b		2.9		V
			VDDAX[1:0]=10b		2.6		V
			VDDAX[1:0]=11b		2.4		V
	Dropout voltage	$I_L = 10\text{mA}$	VDDAX[1:0]=00b		135		mV
			VDDAX[1:0]=01b		150		mV
			VDDAX[1:0]=10b		165		mV
			VDDAX[1:0]=11b		180		mV
	Temperature drift	VDDAX[1:0]=11b	$T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$		50		ppm/ $^\circ\text{C}$
ACM	V _{DD} Voltage drift	$I_L = 0.1\text{mA}$	$V_{DD} = 2.5\text{V} \sim 3.6\text{V}$		± 0.2		%/V
	ACM operation current, I_{ACM}	$I_L = 0\text{mA}$			20		μA
	Output voltage, V_{ACM}	ENACM[0]=1, ^{*1}	$I_L = 0\mu\text{A}$		1.0		V
	Output voltage with Load		$I_L = \pm 200\mu\text{A}$	0.98		1.02	V_{ACM}
	Output voltage, V_{ACM}	ENACM[0]=1, ^{*2}	$I_L = 0\mu\text{A}$		1.2		V
	Output voltage with Load		$I_L = \pm 200\mu\text{A}$	0.98		1.02	V_{ACM}
	Temperature drift	ENACM[0]=1,	$T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$		50		ppm/ $^\circ\text{C}$
	VDDA Voltage drift	$I_L = 10\mu\text{A}$			100		$\mu\text{V/V}$

VDDA : Adjust Voltage Regulator

ACM : Analog Common Mode Voltage

*1: $V_{ACM} = 1.0\text{V}$ is just for VDDAX[1:0]=1xb mode. (at A/D differential voltage reference < 1.4V and delta VR: $(V_{DDA}-V_{SS})/2$)

*2: $V_{ACM} = 1.2\text{V}$ is just for VDDAX[1:0]=0xb mode. (at A/D differential voltage reference > 1.4V and delta VR: $(V_{DDA}-V_{SS})/2$)

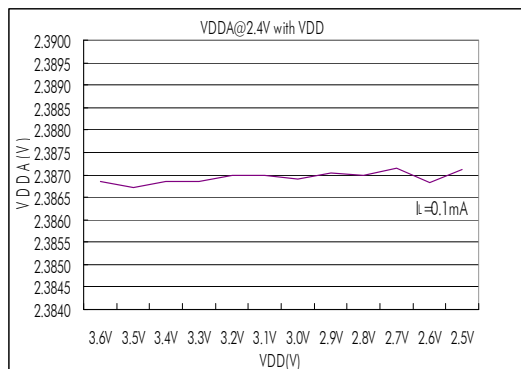


Figure 6.6-1 VDDA $I_L=0.1\text{mA}$ vs. VDD

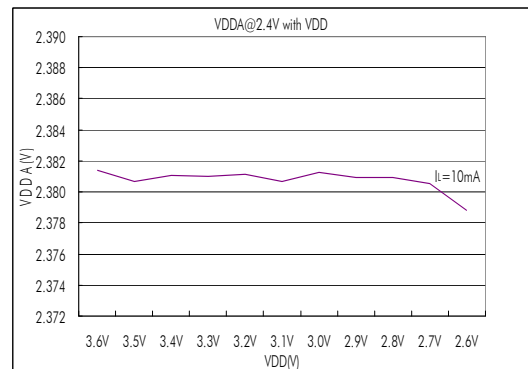


Figure 6.6-2 VDDA $I_L=10\text{mA}$ vs. VDD

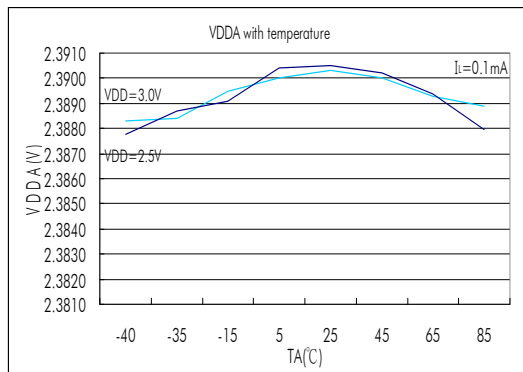


Figure 6.6-3 VDDA $I_L=0.1\text{mA}$ vs. Temperature

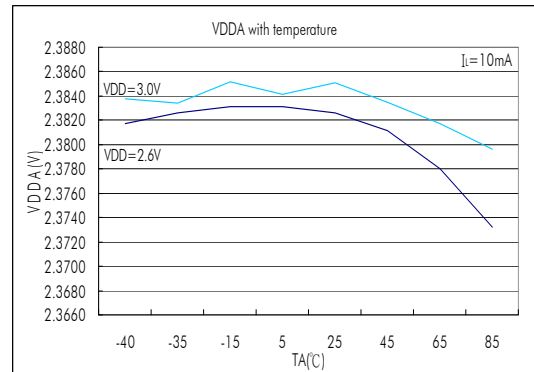


Figure 6.6-4 VDDA $I_L=10\text{mA}$ vs. Temperature

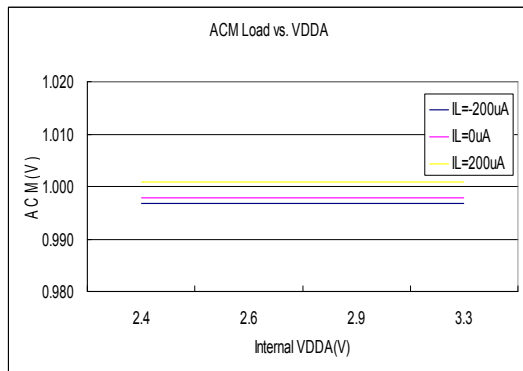


Figure 6.6-5 ACM Load vs. VDDA (a)

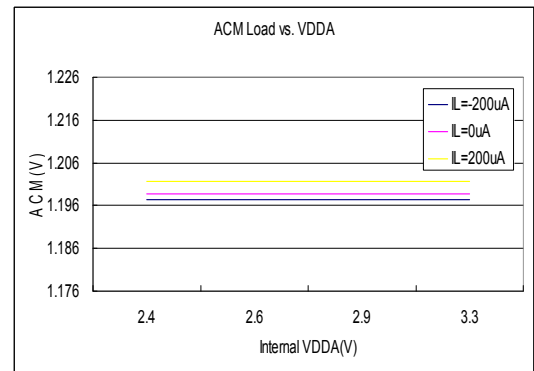


Figure 6.6-5 ACM Load vs. VDDA (b)

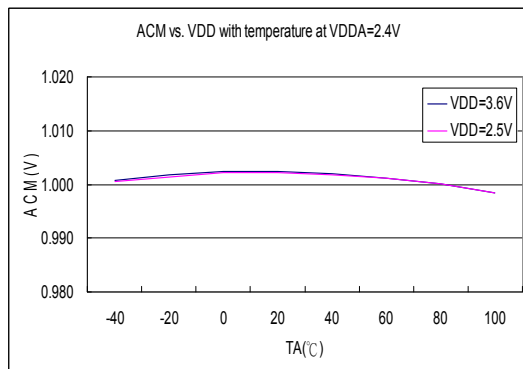


Figure 6.6-6 ACM vs. Temperature (a)

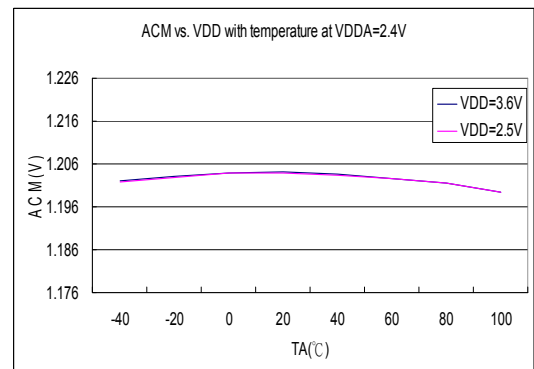


Figure 6.6-6 ACM vs. Temperature (b)

6.7 SD18, Power Supply and recommended operating conditions

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $V_{DDA} = 2.4\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	unit
V_{SD18}	Supply Voltage at VDDA	ENVDDA[0]=0		2.4		3.6	V
f_{SD18}	Modulator sample frequency, ADC_CK			25	250	300	KHz
	Over Sample Ratio, OSR			256		32768	
I_{SD18}	Operation supply current without PGA	ENADC[0]=1 INBUF[0]=1, VRBUF[0]=0	GAIN =4, ADC_CK=250KHz		168		uA
		ENADC[0]=1 INBUF[0]=0, VRBUF[0]=1			150		
		ENADC[0]=1 INBUF[0]=0, VRBUF[0]=0			120		

6.7.1 PGA, Power Supply and recommended operating conditions

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $V_{DDA} = 2.4\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	unit
V_{PGA}	Supply Voltage at VDDA	ENVDDA[0]=0		2.4		3.6	V
I_{PGA}	Operation supply current	PGAGN[1:0]=<01> or <1x>			320		uA
G_{PGA}	Gain temperature drift	$T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	GAIN=128		5		ppm/ $^\circ\text{C}$

6.7.2 SD18, performance II ($f_{SD18}=250\text{KHz}$)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $V_{DDA} = 2.9\text{V}$, $V_{VR} = 1.0\text{V}$, GAIN=1 without PGA, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	unit
INL	Integral Nonlinearity(INL)	VDDA=2.4V,V _{VR} =1.0V,ΔSI=±200mV		±0.003		±0.01	%FSR
		VDDA=2.4V,V _{VR} =1.0V,ΔSI=±450mV					
	No Missing Codes ³	ADC_CK=250KHz,OSR[2:0]=010b		23			Bits
G _{SD18}	Temperature drift	INBUF[0]=0b,VRBUF[0]=0b	T _A = -40℃ ~ 85℃	2			ppm/℃
	Gain 1~x16 (INBUF[0]=0b,)	INBUF[0]=1b,VRBUF[0]=0b					
		INBUF[0]=0b,VRBUF[0]=1b					
		Gain 1~x4 (INBUF[0]=1b,)					
E _{OS}	Offset error of Full Scale Rang input voltage range with Chopper and Buffer(INBUF,VRBUF)	ΔAI=0V ΔVR=0.9V DCSET[2:0]=<000>	Gain=2	1		%FSR	
	Offset error of Full Scale Rang input voltage range with Chopper without Buffer(INBUF,VRBUF)	*ΔAI is external short	Gain=2				1

	Offset temperature drift with chopper without Buffer (INBUF,VRBUF).		GAIN=1	2	$\mu V/^{\circ}C$
			GAIN=2	1	
			GAIN=4	0.5	
			GAIN=16	0.15	
	Offset temperature drift with chopper and Buffer (INBUF,VRBUF)		GAIN=1	2	
			GAIN=2	1	
			GAIN=4	0.5	
	Offset temperature drift with chopper without Buffer (INBUF,VRBUF).		GAIN=128	0.02	
CM _{SD18}	Common-mode rejection	V _{CM} =0.7V to 1.7V, V _{VR} =1.0V, without PGA	V _{SI} =0V, GAIN=1	90	dB
		V _{CM} =0.7V to 1.7V, V _{VR} =1.0V,	V _{SI} =0V, GAIN=16	75	
PSRR	DC power supply rejection	V _{DDA} =3.0V, $\Delta V_{DDA} = \pm 100m$ V, V _{VR} =1.0V,	GAIN=1 PGA=off	75	dB
		V _{SI} =1.2V, V _{SI} =1.2V,	GAIN=16		

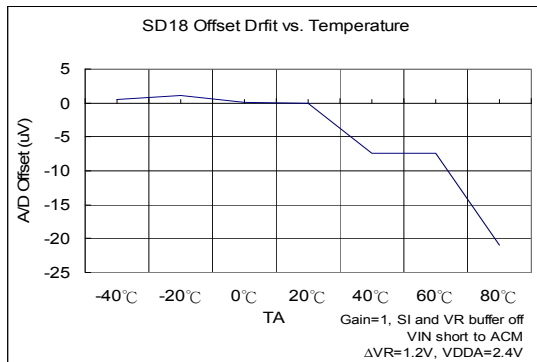


Figure 6.7-1(a) SD18 Offset Temperature drift

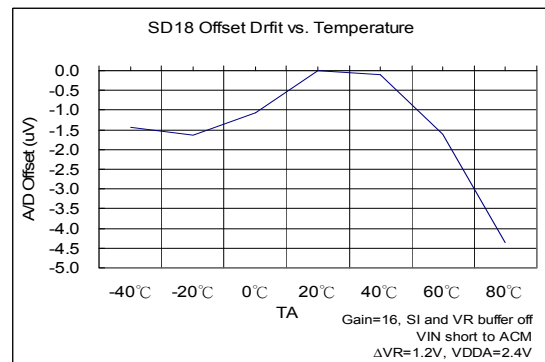


Figure 6.7-1(b) SD18 Offset Temperature drift

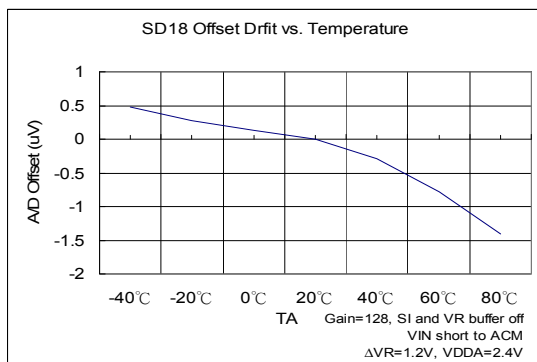


Figure 6.7-1l SD18 Offset Temperature drift

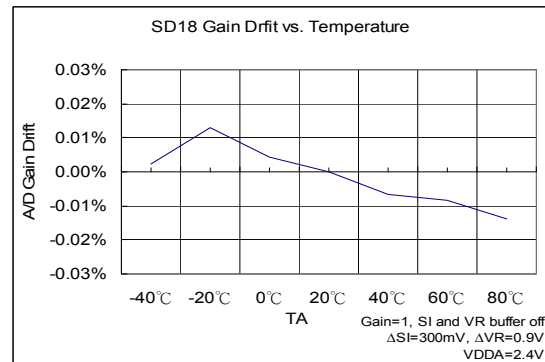


Figure 6.7-2(a) SD18 Gain drift with temperature

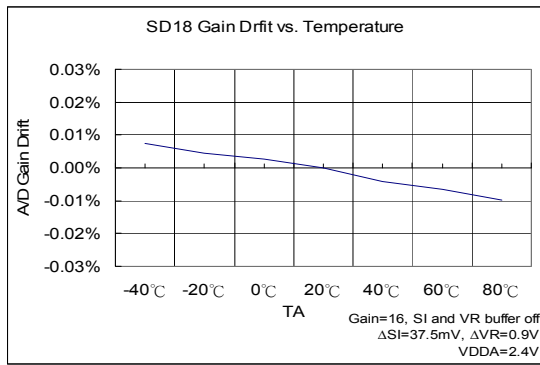


Figure 6.7-2(b) SD18 Gain drift with temperature

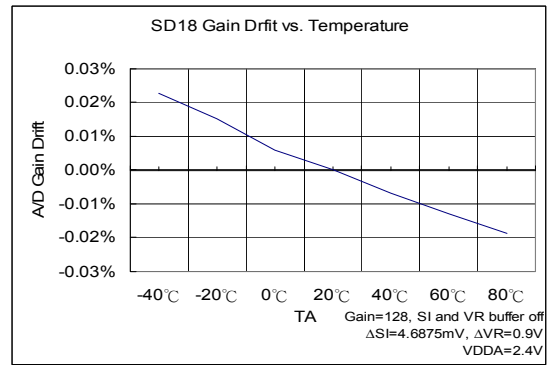


Figure 6.7-2(c) SD18 Gain drift with temperature

6.7.3 SD18, Temperature sensor

 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $V_{DDA} = 2.4\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit
TC_S	Sensor temperature drift			178		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
KT	Absolute Temperature Scale 0°K	INBUF[0]=1		-289		$^\circ\text{C}$
TC_{ERR}	One point calibrate error temperature	Calibration at 25°C of $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$		± 2		$^\circ\text{C}$

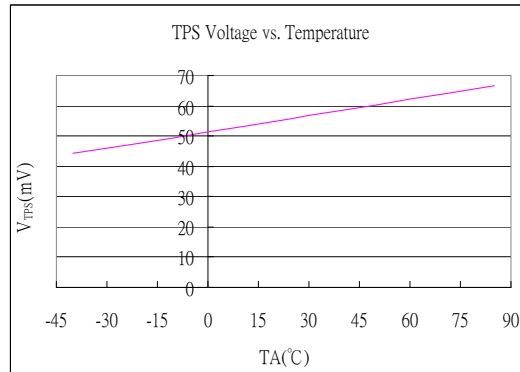


Figure 6.7-3 TPS output voltage vs. temperature drift

6.7.4 SD18 Noise Performance

 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, $V_{DDA} = 2.4\text{V}$, unless otherwise noted

HY11P42 針對 SD18 提供了重要的輸入雜訊規格。Table6.7-4(a), Table6.7-4(b) 列出典型的雜訊規格表與 Gain, Output rate, 及單端最大輸入電壓等關係。測試條件設定在外部輸入訊號短路，參考電壓為 1.2V，取樣 1024 筆資料。

ENOB(RMS) with OSR/GAIN at A/D Clock=250Khz, VDDA=2.4V, VREF=1.2V													
Max. Vin(mV) =0.9*VREF ⁽¹⁾	OSR					256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768
	Output rate(HZ)					977	488	244	122	61	31	15	8
	Gain	=	PGA	x	ADGN								
±2400	0.25	=	1	x	0.25	16.3	17.4	17.9	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4
±2160	0.5	=	1	x	0.5	16.3	17.3	17.9	18.4	18.9	19.4	19.8	20.2
±1080	1	=	1	x	1	16.2	17.2	17.8	18.3	18.8	19.3	19.7	20.1
±540	2	=	1	x	2	16.1	17.1	17.6	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0
±270	4	=	1	x	4	16.0	16.9	17.5	18.0	18.5	18.9	19.4	19.8
±135	8	=	1	x	8	15.9	16.6	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.6
±68	16	=	1	x	16	15.6	16.3	16.8	17.3	17.7	18.3	18.8	19.3
±34	32	=	2	x	16	14.8	15.3	15.9	16.4	16.9	17.4	17.8	18.3
±17	64	=	4	x	16	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
±8	128	=	8	x	16	14.0	14.6	15.1	15.6	16.0	16.6	17.0	17.5

(1) Max.Vin (mV) is the max. input voltage of single end to ground (VSS).

Table6.7-4(a) SD18 ENOB Table

RMS Noise(uV) with OSR/GAIN at A/D Clock=250Khz, VDDA=2.4V, VREF=1.2V													
Max. Vin(mV) =0.9*VREF	OSR					256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768
	Output rate(HZ)					977	488	244	122	61	31	15	8
	Gain	=	PGA	x	ADGN								
±2400	0.25	=	1	x	0.25	121.08	57.40	38.74	26.66	18.39	13.21	9.49	6.98
±2160	0.5	=	1	x	0.5	61.63	29.23	19.21	13.51	9.78	7.02	5.12	3.91
±1080	1	=	1	x	1	32.21	15.70	10.25	7.31	5.19	3.77	2.80	2.13
±540	2	=	1	x	2	16.59	8.54	5.91	4.06	2.86	2.06	1.48	1.12
±270	4	=	1	x	4	9.00	4.84	3.33	2.37	1.67	1.19	0.87	0.65
±135	8	=	1	x	8	5.04	2.97	2.02	1.44	1.01	0.73	0.51	0.39
±68	16	=	1	x	16	3.03	1.84	1.29	0.92	0.70	0.46	0.33	0.24
±34	32	=	2	x	16	2.61	1.81	1.27	0.89	0.62	0.45	0.32	0.23
±17	64	=	4	x	16	1.66	1.13	0.80	0.56	0.41	0.29	0.20	0.14
±8	128	=	8	x	16	1.13	0.77	0.55	0.38	0.28	0.19	0.14	0.10

Table6.7-4(b) SD18 RMS Noise Table

The RMS noise are referred to the input. The Effective Number of Bits (ENOB(RMS Bit)) is defined as:

$$\text{ENOB(RMS)} = \frac{\ln\left(\frac{\text{FSR}}{\text{RMS Noise}}\right)}{\ln(2)}$$

$$\text{RMS Noise} = \frac{\left(2 \times \text{VREF} \times \sqrt{\sum_{k=1}^{1024} (\text{ADO}[k] - \text{Average})^2}\right)}{2^{23}}$$

Where FSR (Full - Scale Range) = $2 \times \text{VREF}/\text{Gain}$.

$$\text{Average} = \frac{\sum_{k=1}^{1024} (\text{ADO}[k])}{1024}$$

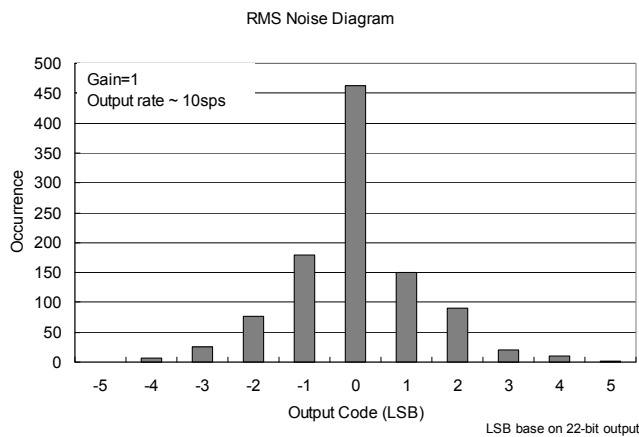


Figure6.7-4(a) RMS Noise Diagram

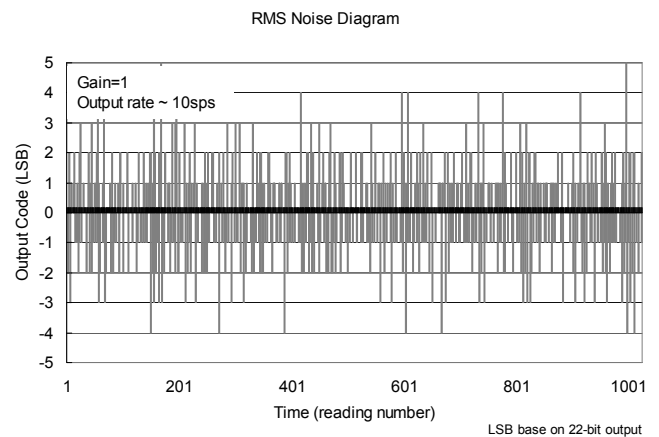


Figure6.7-4(b) Output Code Diagram

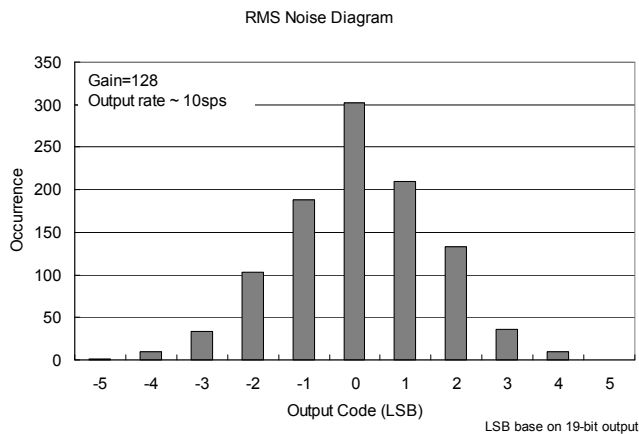


Figure6.7-4(c) RMS Noise Diagram

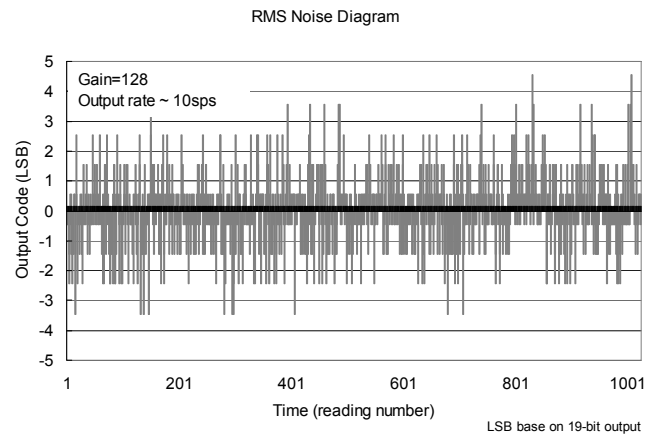


Figure6.7-4(d) Output Code Diagram

6.8 Build-In EPROM(BIE)

$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$, unless otherwise noted

Sym.	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	unit
V_{BIE}	Supply Voltage			6.0	6.5	V
I_{BIE}	Operation supply current			5		mA
V_{SS}	Supply Voltage			0		V

7. 訂貨資訊

下單品名 ¹	封裝型式	引腳數	封裝型式 描述方式		程式碼 編號 ²	出貨包裝 形式	個裝 數量	材料 組成	MSL ³
HY11P42-D000	Die	-	D	000	000	-	200	Green ⁴	-
HY11P42-E028	SSOP	28	E	028	000	Tube	48	Green ⁴	MSL-3
HY11P42-E028	SSOP	28	E	028	000	Tape & Reel	2000	Green ⁴	MSL-3
HY11P42-N024	QFN	24	N	024	000	Tray	490	Green ⁴	MSL-3
HY11P42-T028	TSSOP	28	T	028	000	Tube	50	Green ⁴	MSL-3
HY11P42-T028	TSSOP	28	T	028	000	Tape & Reel	3000	Green ⁴	MSL-3

¹ 產品名稱 – 封裝型式描述方式 – 程式碼編號（空白片 / 標準品 / 代客燒錄碼）

例如：您的代客燒錄服務申請的程式碼編號為 008，且需要的產品是裸片出貨。則下單品名為 HY11P42-D000-008

例如：您的需求是不帶程式碼的空白片且需要的產品是裸片出貨。則下單品名為 HY11P42-D000

例如：您的需求是不帶程式碼的空白片且需要的產品是封裝片 SSOP28 出貨。則下單品名為 HY11P42-E028 例如：您的需求是不帶程式碼的空白片且需要的產品是封裝片 SSOP28 出貨，則下單品名為 HY11P42-E028，且需以 Tape & Reel 出貨，則除下單品名外，請特別註明出貨包裝形式為 Tape & Reel

例如：您的代客燒錄服務申請的程式碼編號為 009，而需求的產品是封裝片 TSSOP28 出貨，則下單品名為 HY11P42-T028-009，且需以 Tube 出貨，則除下單品名外，請特別註明出貨包裝形式為 Tube

² 程式碼編號

“001”~“999” 為標準品或代客燒錄申請的程式碼編號，而空白晶片不帶此碼。

³ MSL:

濕度敏感性等級係依據 IPC/JEDEC J-STD-020 的規範加以試驗分級，並參考 IPC/JEDEC J-STD-033 的標準處理、包裝、運輸與使用。

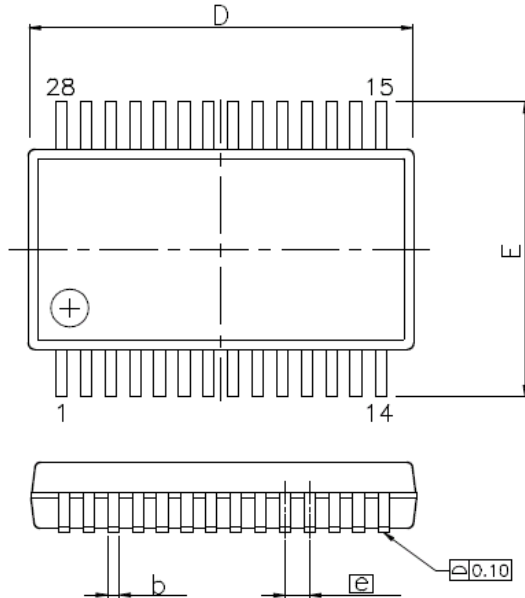
⁴ Green (RoHS & no Cl/Br):

HYCON 產品皆為 Green Product，符合 RoHS 指令以及無鹵素規定(Br/Cl<0.1%)

8. 封裝型式資訊

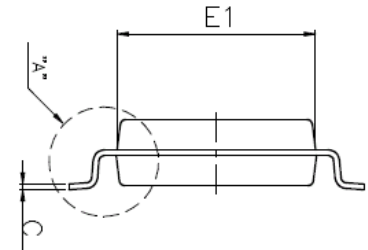
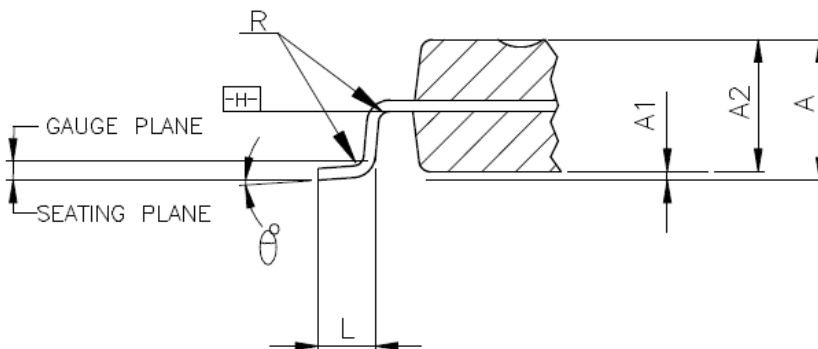
8.1 SSOP28(E028)

8.1.1 Package Dimensions



SYMBOLS	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	2.0
A1	0.05	—	—
A2	1.65	1.75	1.85
b	0.22	—	0.38
c	0.09	—	0.25
D	10.05	10.20	10.50
E	7.65	7.80	7.90
E1	5.00	5.30	5.60
e	0.65 BSC		
L	0.55	0.75	0.95
R	0.09	—	—
θ°	0°	4°	8°

UNIT : MM



JEDEC MO-150 compliant

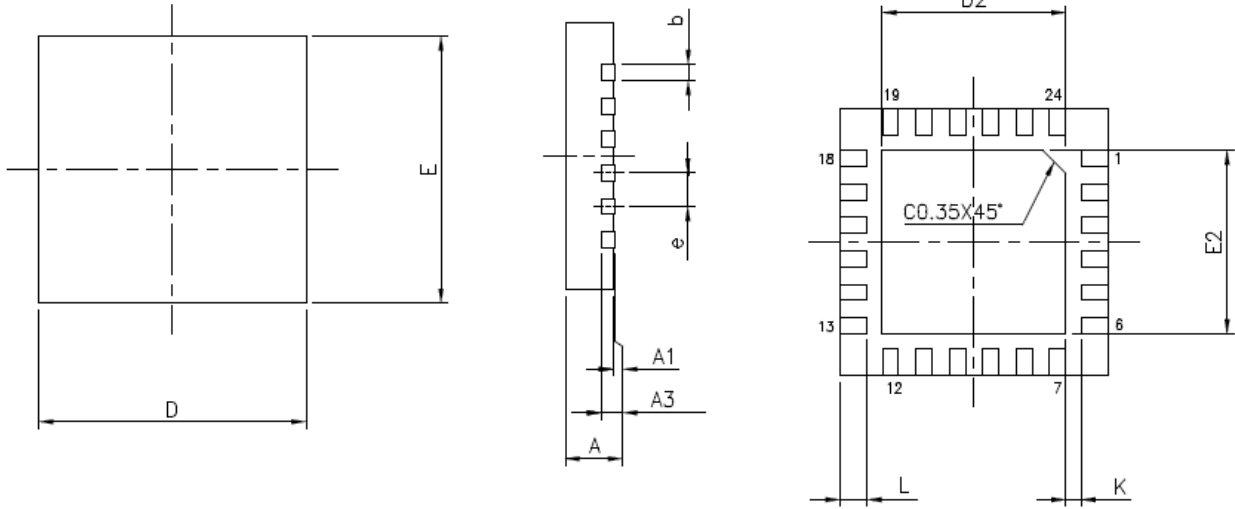
HY11P42

Embedded 18-Bit $\Sigma\Delta$ ADC

8-Bit RISC-like Mixed Signal Microcontroller

8.2 QFN24(N024)

8.2.1 Package Dimensions



EXPOSED PAD	D2			E2			JEDEC
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.	
2.7X2.7	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80	WG6D-6

UNIT : mm

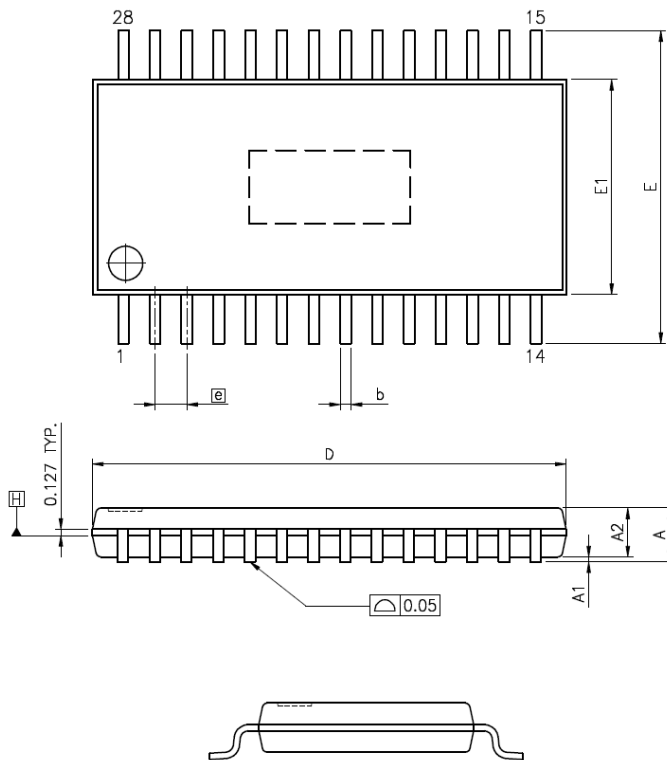
SYMBOLS	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3	0.20 REF.		
b (w/o plating)	0.18	0.25	0.30
D	3.90	4.00	4.10
E	3.90	4.00	4.10
e	0.50 BSC.		
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—

UNIT : mm

JEDEC MO-220 complian

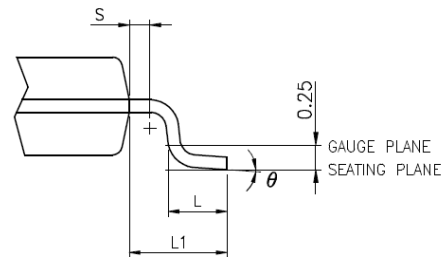
8.3 TSSOP28(T028)

8.3.1 Package Dimensions



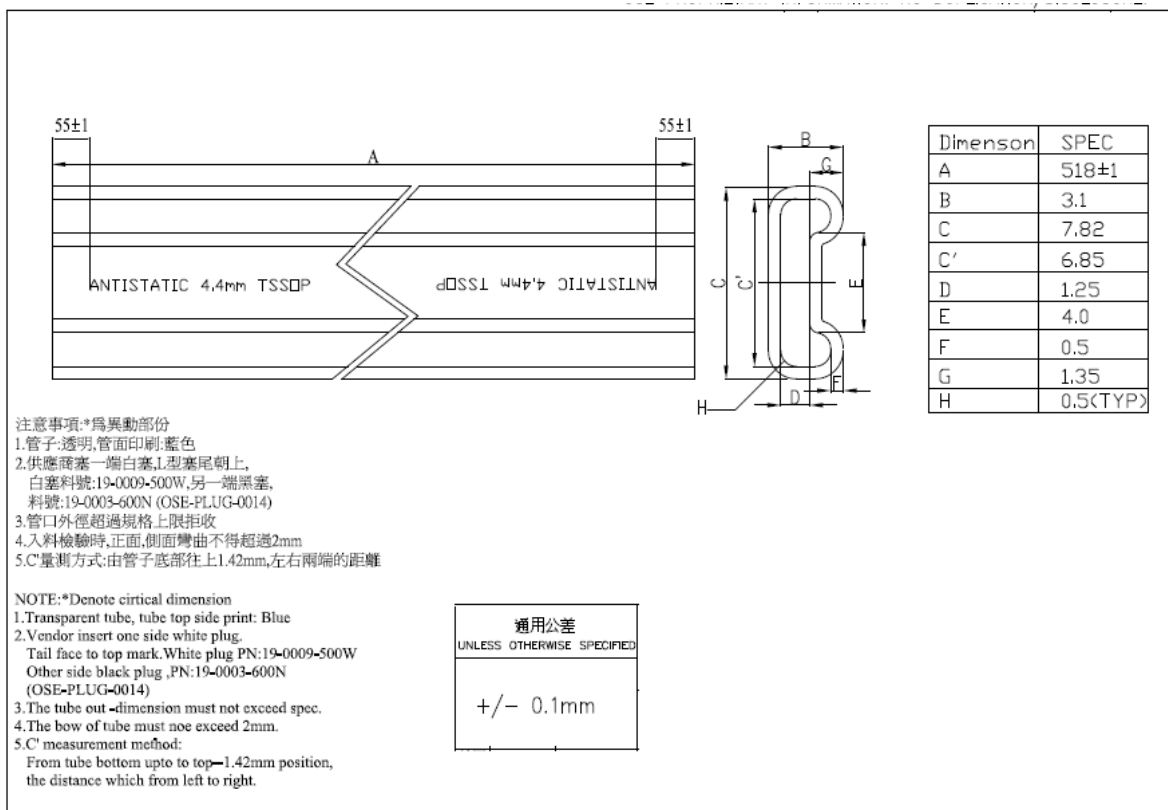
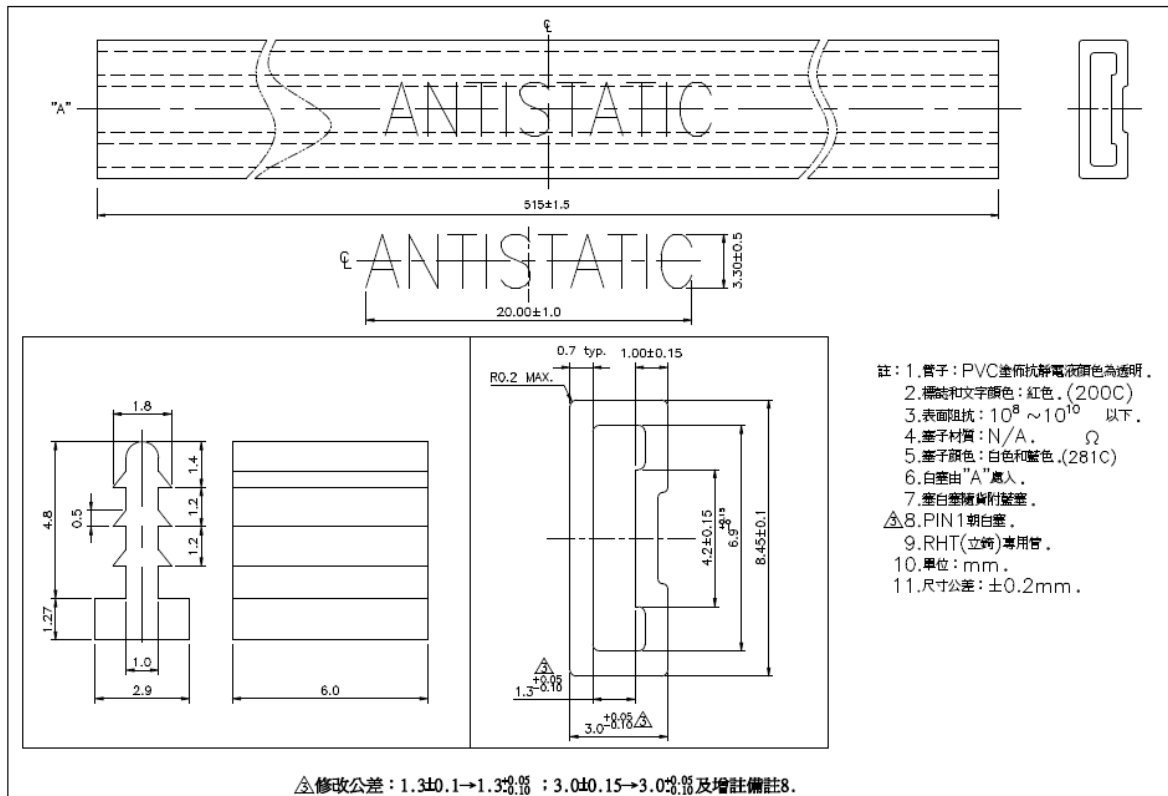
VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOLS	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.20
A1	0.00	—	0.15
A2	0.80	1.00	1.05
b	0.19	—	0.30
D	9.60	9.70	9.80
E1	4.30	4.40	4.50
E	6.40 BSC		
e	0.65 BSC		
L1	1.00 REF		
L	0.45	0.60	0.75
S	0.20	—	—
θ	0°	—	8°



JEDEC MO-153 compliant

8.3.2 Tube Dimensions



9. 修訂記錄

以下描述本文件差異較大的地方，而標點符號與字形的改變不在此描述範圍。

版本	頁次	變更摘要
V01	ALL	初版發行
V02	8-10	刪除 3.應用電路 EEPROM 線路
V03	4	修改 1.特點內容
	14	修改 6.電氣特性內容
V04	11	修改 4.1.內部方塊圖
		修改硬體使用說明書編號
	12	修改圖 4-2 SD18 Network
	13	修改表 5-1 暫存器列表
V05	7	修改 I/O 引腳定義順序
V06	5	增加 TSSOP28 引腳圖
	10-11	修改應用電路圖
	31	增加訂貨資訊
	34	增加封裝型式資訊
V07	13	修改開發工具相關使用說明書編號
	32	增加訂貨資訊
V08	5~9,14~17,19	刪除串列通訊 SPI 模組相關說明
	10~11	增加 I/O 引腳定義(TSSOP28)
	12~13	增加 I/O 引腳定義(QFN24)
V09	8~13, 25	更新 LVDIN, LVD 名稱及刪除不存在腳位名稱
V10	21	更新 Internal RC Oscillator 頻率規格